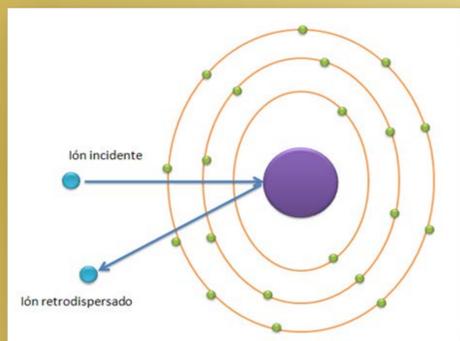
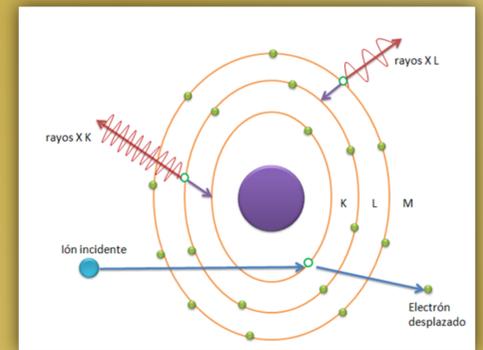


# TÉCNICAS DE ANÁLISIS

## Emisión de rayos X inducida por partículas (PIXE)

- Obtención de la concentración de elementos en la superficie de la muestra
  - Espectro de rayos X
    - No destructiva
    - Multielemental
    - Alta sensibilidad

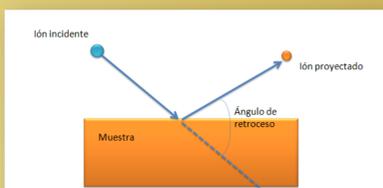
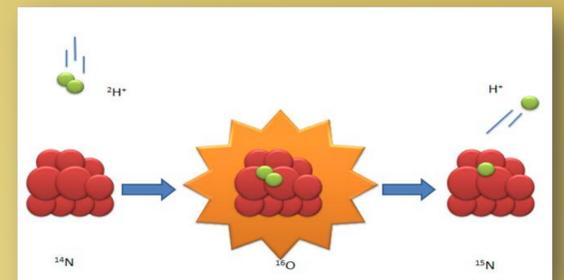


## Espectrometría de retrodispersión Rutherford (RBS) y canalización iónica

- Determinación de estequiometría y densidad superficial elemental de los sólidos
  - No destructiva
- Análisis en profundidad, interfaces, capas finas, estructuras multicapa
- Localización de impurezas, estudio de daños

## Análisis por reacciones nucleares (NRA)

- Determinación de concentraciones absolutas y distribuciones en profundidad
  - Perfilado isotópico
- Estudios de difusión, corrosión, etc.
  - Dispersiones elásticas
  - Reacciones ión-gamma
  - Reacciones ión-ión



## Análisis de átomos desplazados elásticamente (ERD)

- Detección de átomos de la muestra tras ser arrancados
- Identificación de masas atómicas y distribución en profundidad
- Detección y cuantificación de hidrógeno en Ciencia de Materiales

## Fluorescencia de rayos X (XRF)

- Emisión policromática continua o emisión espontánea de radionucleidos
- Emisión de rayos X característicos de la muestra
- Equipo portátil: tubo de rayos X, detector de Si(Li), láser adicional

